

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日  
Date of Application: 2001年 2月28日

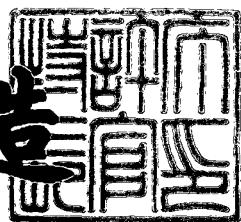
出願番号  
Application Number: 特願2001-055932  
[ST.10/C]: [JP2001-055932]

出願人  
Applicant(s): 古河電気工業株式会社

2002年 5月27日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2002-3039129

【書類名】 特許願  
【整理番号】 A00578  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【国際特許分類】 C03B 37/12  
G01L 5/04  
G02B 6/00 356

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 仲 恒宏

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 小林 宏之

【特許出願人】

【識別番号】 000005290

【氏名又は名称】 古河電気工業株式会社

【代表者】 古河 潤之助

【電話番号】 045-311-1220

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 005267

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光ファイバの線引張力測定方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光ファイバの線引時に該光ファイバの振動を測定し、該振動波形を周波数解析してスペクトル成分を求め、該スペクトル成分に含まれるピーク周波数から前記光ファイバの基本振動数を決定し、該基本振動数を前記光ファイバの線引中の張力に換算する光ファイバの線引張力測定方法において、前記光ファイバの基本振動数の決定は、前記スペクトル成分に含まれている等間隔の調和振動列関係にある少なくとも2個のピーク周波数の群を調和振動列群として特定する工程と、特定された該調和振動列群に含まれる各ピーク周波数に基づいて前記光ファイバの基本振動数を決定する工程とを含んだ工程により行われることを特徴とする光ファイバの線引張力測定方法。

【請求項2】 前記調和振動列群を特定する際に、前記スペクトル成分の自己相関を計算して等間隔の調和振動列関係にあるピークを強調することを特徴とする、請求項1記載の光ファイバの線引張力測定方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は光ファイバの製造方法に関するものであって、具体的には光ファイバの線引中の張力を正確かつ安定に測定するための方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

一般に、光ファイバを製造する際、光ファイバ母材を下端部から加熱溶融してその溶融変形部を線状に延伸する。また加熱延伸直後に得られる光ファイバの表面を熱硬化型樹脂または紫外線硬化型樹脂などで被覆する。こうした加熱延伸手段で光ファイバを製造することを一般に線引きと称している。

【0003】

光ファイバ母材を線引して光ファイバを得る場合、線引時の張力が管理されないと光ファイバの伝送特性、特に伝送損失に長手方向の変化が現れるので、線引

時の張力は所要の値となるように管理する必要がある。具体的には光ファイバの線引時の張力を測定し、制御する必要がある。

## 【0004】

また、光ファイバの張力を測定する場合、接触式の測定器を用いると光ファイバに傷が付くので、一般に非接触式の測定器を用いて光ファイバの張力が測定される。

## 【0005】

ここで、光ファイバの線引張力測定方法について説明する。光ファイバの線引張力の測定は、線引き時における光ファイバの振動を利用する方法が一般的である。

## 【0006】

この方法は、測定された振動波形のスペクトルのピークから基本振動数  $f$  を求めた後、その基本振動数  $f$  を下記の数1の式に代入して目的の張力  $T$  を求めるというものである。

## 【0007】

## 【数1】

$$T = (2 \cdot L \cdot f)^2 \cdot \rho \cdot \alpha$$

## 【0008】

上記数1の式中、 $L$  は光ファイバ母材と光ファイバに第1被覆層を形成するときのコーティング用ダイス（第1コーティング用ダイス）との間の距離である。また、 $\rho$  は線密度、 $\alpha$  は補正係数である。

## 【0009】

一方、数1の式で張力  $T$  を測定するためには、基本振動数  $f$  を求める必要がある。従来の方法として、特開昭62-137531号に示されるように、振動波形をフーリエ変換してその周波数成分から基本振動数を決定する方法が知られている。

## 【0010】

しかし、特開昭62-137531号公報に示された方法では、基本振動数以外のスペクトルピークが現れた場合には基本振動数の認定が困難となる。現実に

は基本振動数の整数倍振動のピークや、基本振動数の整数倍に該当しないピークが現れるため、それらの影響を除去しなければならない。

## 【0011】

そこで、米国特許5079433号公報に示されるように、スペクトルピークから基本振動と2倍振動との関係に近いものを見つける方法がある。

## 【0012】

また、特開平10-316446号公報に示されるように、初回のピーク周波数検索を行う際に、例えば目標値近傍などのようにピーク周波数を含むことが予測される周波数範囲内で行い、前回検出のピーク周波数にピーク周波数検索の中心値を移動させた状態で次回以降のピーク周波数検索を行う方法などがある。

## 【0013】

## 【発明が解決しようとする課題】

しかし、米国特許5079433号公報や特開平10-316446号公報に記載された技術は、ノイズが光ファイバの基本振動数またはその整数倍振動に近い振動数である場合や、ピーク検索範囲内にノイズピークがある場合には、基本振動数の誤測定を行うおそれがある。

## 【0014】

## 【課題を解決するための手段】

そこで、本発明は、上記の課題を解決するため、ノイズの発生状況にかかわらず光ファイバの基本振動数  $f$  を正確に認識することにより、正確に光ファイバの線引張力  $T$  を測定する手段を提供する。

## 【0015】

請求項1の発明は、光ファイバの線引時に該光ファイバの振動を測定し、該振動波形を周波数解析してスペクトル成分を求め、該スペクトル成分に含まれるピーク周波数から前記光ファイバの基本振動数を決定し、該基本振動数を前記光ファイバの線引中の張力に換算する光ファイバの線引張力測定方法において、前記光ファイバの基本振動数の決定は、前記スペクトル成分に含まれている等間隔の調和振動列関係にある少なくとも2個のピーク周波数の群を調和振動列群として特定する工程と、特定された該調和振動列群に含まれる各ピーク周波数に基づいて

て前記光ファイバの基本振動数を決定する工程とを含んだ工程により行われることを特徴としている。

#### 【0016】

また、請求項2の発明は、請求項1の発明において、前記調和振動列群を特定する際に、前記スペクトル成分の自己相関を計算して等間隔の調和振動列関係にあるピークを強調することを特徴としている。

#### 【0017】

請求項1の発明においては、光ファイバの振動波形のスペクトル成分に含まれるピーク周波数から前記光ファイバの基本振動数を決定する際に、まず前記スペクトル成分に含まれている等間隔の調和振動列関係にある少なくとも2個のピーク周波数の群を調和振動列群として特定することで該調和振動列群に該当しない非周期的なピークをノイズであると判定して前記ピーク群から除去し、次に該調和振動列群に含まれる各ピーク周波数から前記光ファイバの基本振動数を決定することにより、正確に光ファイバの基本振動数を求めることが可能となる。

#### 【0018】

また、請求項2の発明においては、調和振動列群を抽出する際に、スペクトル成分の自己相関を計算して等間隔の調和振動列関係にあるピークを強調することにより、簡単かつ確実に調和振動列群を特定することが可能となる。

#### 【0019】

##### 【発明の実施の形態】

本発明の実施形態を、図面に基づき説明する。

#### 【0020】

図1は本発明に係る光ファイバの線引張力測定方法に用いられる光ファイバの線引装置の一例を示す説明図である。図1に例示された線引装置は、加熱炉1内に挿入された光ファイバ母材2をヒータ3により下端部から加熱溶融し、その溶融部を延伸し、光ファイバ母材2→光ファイバ4a→1次被覆光ファイバ4b→2次被覆光ファイバ4cというように、2次被覆光ファイバ4cを連続的に製造するものである。

#### 【0021】

図1において、加熱炉1は円筒形のカーボン製ヒータ3を内蔵している。リング形をした外径測定器5は、加熱炉1外に出た線引き直後の光ファイバ4aの外径を測定するためのものである。細長い円筒形をした冷却器6は、外径測定器5を通過した後の光ファイバ4aを冷却するためのものである。非接触式振動検出センサ7は、冷却器6を通過した後にその内部を通る光ファイバ4aの振動を検出するためのものであり、例えばレーザ式変位計からなる。第1のコーティング用ダイス9は、その内部を通る光ファイバ4aの外周面に熱硬化性樹脂または紫外線硬化性樹脂を塗布して1次被覆層を形成するためのものである。第1の被覆硬化装置10は、その内部を通る1次被覆光ファイバ4bに塗布された被覆樹脂を硬化させるためのものである。この第1の被覆硬化装置10については、例えば被覆樹脂が熱硬化性樹脂のときには加熱式のものが用いられ、被覆樹脂が紫外線硬化性樹脂のときには紫外線照射式のものが用いられる。第2のコーティング用ダイス11や第2の被覆硬化装置12は、既述の第1のコーティング用ダイス9や第1の被覆硬化装置10とそれぞれ実質的に同じかこれらに準ずるものである。ターンシープ13は、第2の被覆硬化装置12を通過した後の2次被覆光ファイバ4cを図示しない巻取機へ誘導するために進行方向をえるものである。

#### 【0022】

図1の光ファイバ線引装置における張力測定系は、非接触式振動検出センサ7および非接触式振動検出センサ7から入力された信号に基づき光ファイバ4aの張力Tを算出する張力測定器8などで構成される。これらの機器は、例えば非接触式振動検出センサ7→第1張力測定器8のように電気的に接続されている。

#### 【0023】

図1に例示された装置において、張力測定器8はパーソナルコンピュータ、プログラマブルコンピュータなどからなる。

#### 【0024】

図1の光ファイバ線引装置を用いて、光ファイバ母材2から光ファイバ4a・1次被覆光ファイバ4b・2次被覆光ファイバ4cなどが以下のように段階的かつ連続的に製造される。

#### 【0025】

加熱炉1内にほぼ定速で挿入されていく光ファイバ母材2は、炉内のヒータ3で下端部から加熱溶融されその溶融部をたとえば1分あたり100m～1500mの速度で引き取られることで例えば直径が125μmの極細の光ファイバ4aになる。加熱炉1外へ出た直後の光ファイバ4aは外径測定器5で外径を測定され、冷却器6内で冷却される。

#### 【0026】

冷却器6内を通過した光ファイバ4aは非接触式振動検出センサ7によって振動を検出された後、第1のコーティング用ダイス9により樹脂を塗布されて1次被覆光ファイバ4bになり、その1次被覆層が第1の被覆硬化装置10で硬化される。

#### 【0027】

被覆硬化装置10内を通過した1次被覆光ファイバ4bは第2のコーティング用ダイス11による樹脂コーティングを受けて2次被覆光ファイバ4cになり、その2次被覆層が第2の被覆硬化装置12で硬化される。

#### 【0028】

さらに第2の被覆硬化装置12内を通過した2次被覆光ファイバ4cは、タンシーブ13を経由して図示しない巻取機に巻き取られる。

#### 【0029】

図1を参照して述べた上記の例では、所定位置に配置された非接触式振動検出センサ7が光ファイバ4aの振動を検出し、非接触式振動検出センサ7から振動検出信号を入力された張力測定器8が光ファイバ4aの張力Tを算出する。

#### 【0030】

本発明において、光ファイバの振動を非接触式振動検出センサで検出し、その検出データに基づき光ファイバ張力を張力測定器で求める場合は、具体的の一例として図2に示す下記ステップS1～ステップS5が採用される。

#### 【0031】

##### ステップS1：スペクトル解析周波数範囲の設定

スペクトル解析周波数範囲を設定する。具体的には張力測定器8の初期値として設定する。

## 【0032】

ステップS2：データ取り込み

張力測定器8において、たとえばサンプリング間隔を数ミリ秒～数十ミリ秒にして非接触式振動検出センサ7から線位置データを数十秒間取り込み、その数十秒間で取り込んだ線位置データをメモリする。

## 【0033】

ステップS3：FFT演算

線位置データをFFT（高速フーリエ変換：fast Fourier transform）で演算して離散データのフーリエ成分を求める。

## 【0034】

ステップS4：自己相関の計算

ステップS3で求められたFFT演算結果のスペクトル成分の自己相関を計算して等間隔の調和振動列関係にあるピークを強調し、該スペクトル成分中に含まれている等間隔の調和振動列関係にある少なくとも2個のピーク周波数の群を調和振動列群として特定する。その際、振幅の小さいノイズ成分の影響を除去するため、平滑化が行われる。この様にして周波数0と1個目のピーク周波数間、1個目のピーク周波数と2個目のピーク周波数間………が同じくなる調和振動列関係を特定する。

## 【0035】

ステップS4における自己相関の計算の際には、下記の式を用いる。

## 【0036】

## 【数2】

$$\rho(k) = \frac{\sum_{i=1}^{n-k} x(i+k) \cdot x(i) - \bar{x}_o \cdot \bar{x}_k}{\sqrt{\left\{ \sum_{i=1}^{n-k} x^2(i) - \bar{x}_o^2 \right\} \left\{ \sum_{i=1}^{n-k} x^2(i+k) - \bar{x}_k^2 \right\}}}$$

ただし  $\bar{x}_o(k) = \frac{1}{n-k} \sum_{i=k+1}^n x(i)$

$$\bar{x}_k(k) = \frac{1}{n-k} \sum_{i=1}^{n-k} x(i)$$

## 【0037】

ここで、光ファイバの振動波形の一例を図3に、図3の振動波形をFFT演算して得られたスペクトル成分を図4に示す。

## 【0038】

具体的には、上記数2の式を用いるため、図4のスペクトル波形図で示されるスペクトルデータを周波数軸について離散されたデータとしてn個読み取る。次に、図4の周波数軸上に配置されるi番目（iは1からnまでの整数）のデータ  $x(i)$  についての自己相関を数2の式により求める。

## 【0039】

上記ステップS4による図4のスペクトル成分の自己相関計算結果を図5に示す。図5を図4と比較すると、図4における調和振動列群に該当しない非周期的なピークはノイズであると判定され、前記スペクトル成分中から除去されて図5では調和振動列群に相当する周波数のみにピークが存在している。

## 【0040】

ステップS5：張力の計算

ステップS4で特定された調和振動列群の基本振動数（最も低い振動数のピーク）を光ファイバの基本振動周波数fと決定し、その値を数1の式に代入して光ファイバの張力Tを求める。

#### 【0041】

図2に示されるステップを実行した結果、光ファイバの線引中の張力は、ノイズの発生状況にかかわらずほぼ正確に測定された。

#### 【0042】

なお、本発明の実施形態は、図2の各ステップに具体例を示したものに限られず、特許請求の範囲に記載された範囲において自由に変更可能である。たとえばステップS4で特定される調和振動列群のピーク周波数の個数は3個以上であれば何個でもよく、ステップS5においては、ステップS4で特定された調和振動列群のピーク間隔の平均値を光ファイバの基本振動周波数fと決定するなどの変更を行ってもよいことはいうまでもない。

#### 【0043】

##### 【発明の効果】

以上のとおり、本発明によれば、光ファイバの振動波形のスペクトル成分に含まれるピーク周波数から前記光ファイバの基本振動数を決定する際に、まず前記スペクトル成分に含まれている等間隔の調和振動列関係にある少なくとも3個のピーク周波数の群を調和振動列群として特定することで該調和振動列群に該当しない非周期的なピークをノイズであると判定して前記ピーク群から除去し、次に該調和振動列群に含まれる各ピーク周波数から前記光ファイバの基本振動数を決定することにより、正確に光ファイバの基本振動数を求めることが可能となる。

#### 【0044】

また、調和振動列群を抽出する際に、前記スペクトル成分の自己相関を計算して等間隔の調和振動列関係にあるピークを強調することにより、簡単かつ確実に調和振動列群を特定することが可能となり、その結果線引中の光ファイバの張力をより正確に測定することが可能となる。

##### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施形態である光ファイバの線引張力測定方法が適用される

光ファイバ線引装置の一例を示す概略説明図である。

【図2】 本発明の実施形態における、光ファイバの線引張力を求めるときの各ステップを例示した流れ図である。

【図3】 光ファイバの振動波形の一例を示す波形図である。

【図4】 図3の波形図をスペクトル解析した結果を示す波形図である。

【図5】 図4の波形図に示されるスペクトル成分の自己相関を計算した結果を示す波形図である。

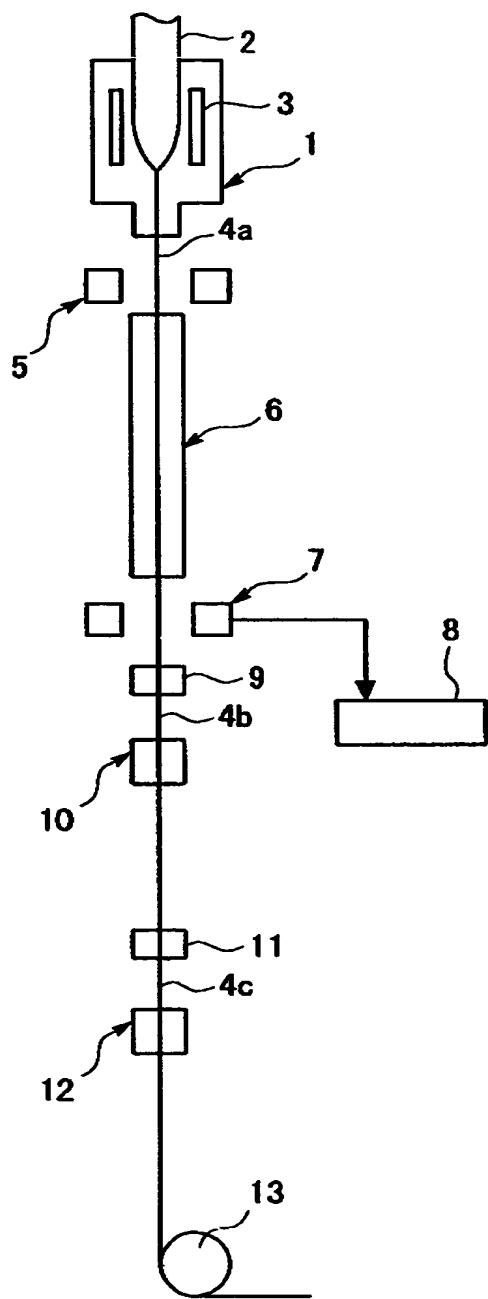
【符号の説明】

- 1 加熱炉
- 2 光ファイバ母材
- 3 ヒータ
- 4 a 光ファイバ
- 4 b 1次被覆光ファイバ
- 4 c 2次被覆光ファイバ
- 5 外径測定器
- 6 冷却器
- 7 第1の非接触式振動検出センサ
- 8 第1の張力測定器
- 9 第1のコーティング用ダイス
- 10 第1の被覆硬化装置
- 11 第2のコーティング用ダイス
- 12 第2の被覆硬化装置
- 13 ターンシープ

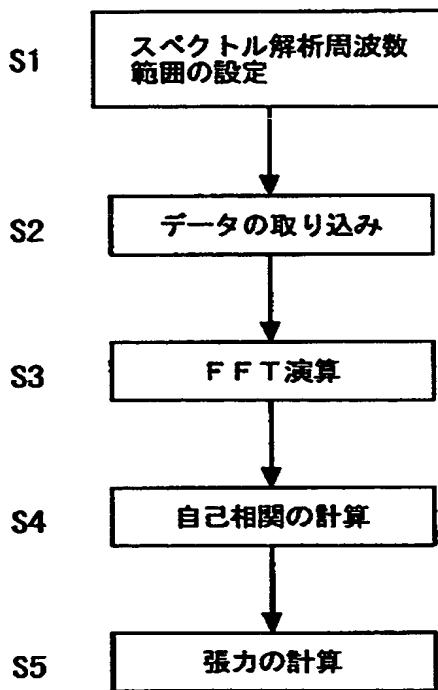
【書類名】

図面

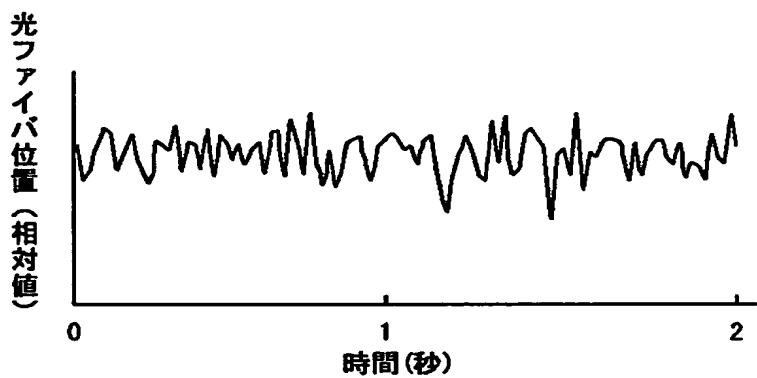
【図1】



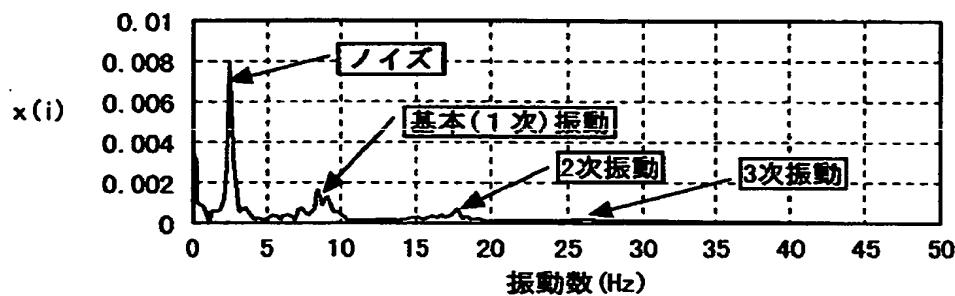
【図2】



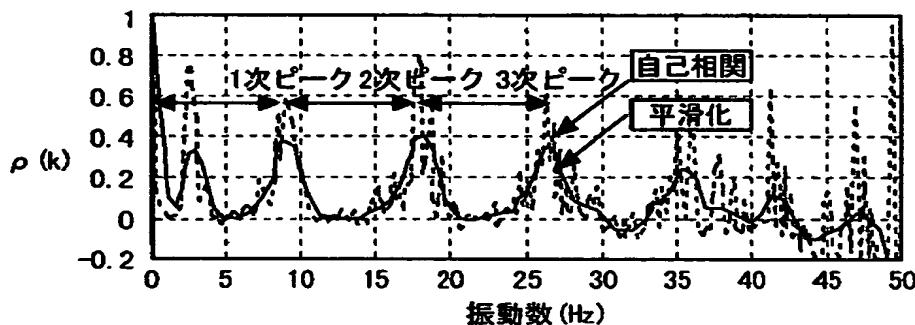
【図3】



【図4】



【図5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 光ファイバの振動波形を利用して所要の線引き張力を測定する方法について、その振動波形スペクトルのピーク周波数がノイズの影響を受けることなく正確・安定・容易に検出可能な手段を提供する。

【解決手段】 光ファイバ線引時に該光ファイバの振動を測定し、その振動波形を周波数解析したスペクトル成分から等間隔の調和振動列関係にあるピーク周波数の群を調和振動列群として特定し、該調和振動列群に含まれるピーク周波数の基本振動数を前記光ファイバの線引中の張力に換算する。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2001-055932
受付番号	50100287100
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0094
作成日	平成13年 3月 1日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成13年 2月28日

次頁無

出願人履歴情報

識別番号 [000005290]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号  
氏名 古河電気工業株式会社